

集積回路設計ミーティング

2024年2月13日 B4 小島光

目次



- 工程表
- ワイドメタルの判定
- メッシュとPADの接続
- 全体のレイアウト
- ポストレイアウトシミュレーション

工程表



			達成率	2月5日	2月13日	2月20日	2月26日
レイアウト	TEG	レイアウト	80 %		—		
		寄生抽出&修正	0 %				
		電源強化	0 %			←	
		寄生抽出&修正	0 %				←
	乗算回路(針)	レイアウト	100 %	—			
		寄生抽出&修正	0 %				
	乗算回路(PCB)	レイアウト	50~%	—			
		寄生抽出&修正	0 %			—	
		電源強化	0 %			←	
		寄生抽出&修正	0 %				•

針測定用のレイアウトで寄生抽出をしたところ設計との差が 大きく、電源強化前に寄生抽出をするべきだった。



大きなメタルは「ワイドメタル」として扱われる。

基本的なワイドメタルの判定方法は 「短辺が $10 \mu m$ より大きい」こと。単純な長方形 ならこれで問題ない。

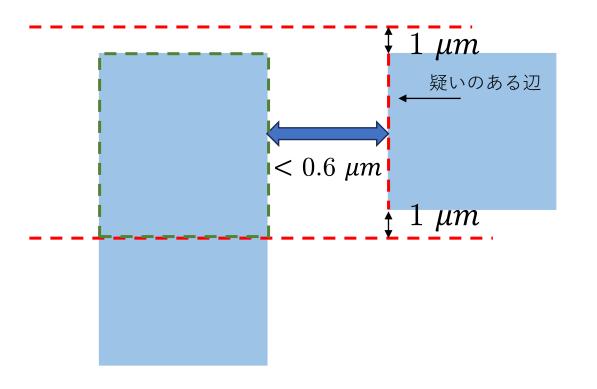
ワイドメタルと同レイヤーのメタルの間隔は $0.6 \mu m$ 以上である必要がある。

幅が $35 \mu m$ を超えると(PADを除く)スリットが必要になる。

以下は検証したワイドメタルの判定方法。例外・矛盾があった場合は教えてください。



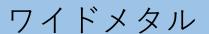




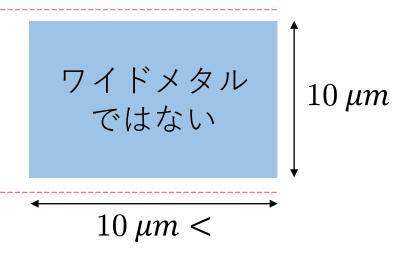
メタル同士の間隔が $0.6 \mu m$ 未満、メタルの 片方でもワイドメタルになる可能性がある時 DRCエラー発生の可能性。

ワイドメタルの可能性がある場合、 疑われる辺(短い方)の両端 $1 \mu m$ で囲われる 図形の内、疑いのある辺を含む長方形を検査。



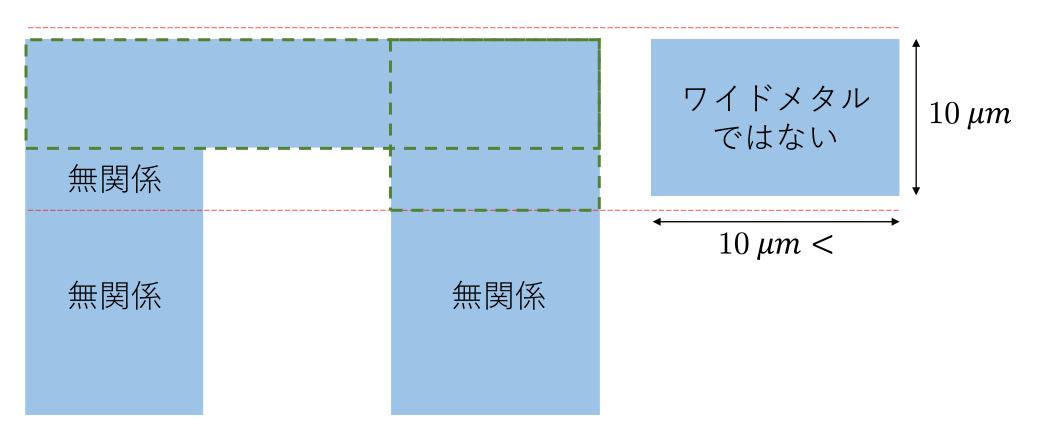


無関係



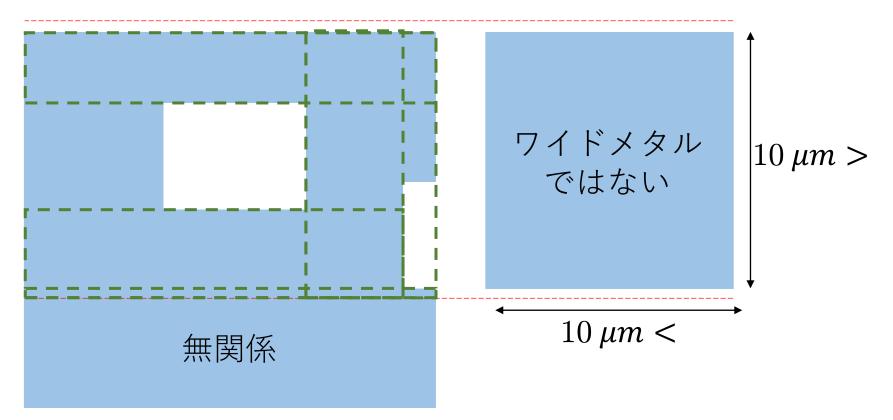
この図の場合は赤線で囲まれた長方形の短辺が $10 \mu m$ より大きいのでワイドメタルとなりDRCエラー





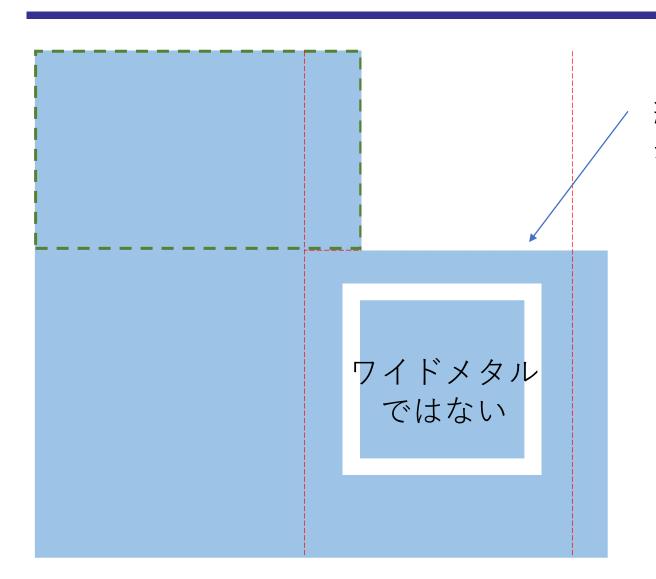
緑点線で囲まれた長方形の短辺が $10~\mu m$ 以下 であればDRCエラーはなし。





緑点線で囲まれた長方形の短辺が $10~\mu m$ 以下 であればDRCエラーはなし。



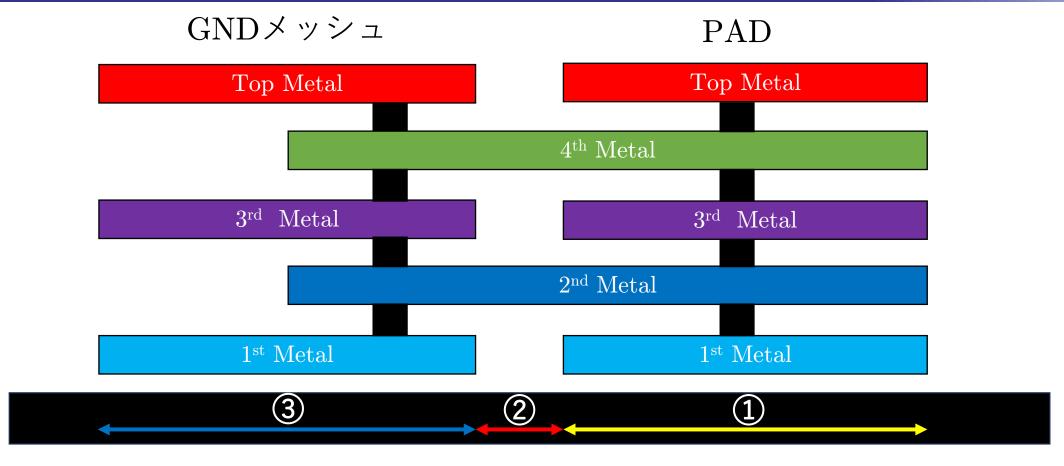


この辺に関して、 緑点線のように検討する辺と、 赤点線で囲まれた部分に検討す る辺と直行する緑点線で作られ る長方形についてワイドメタル の判定をする。

これを各辺について検査する。

メッシュとPADの接続

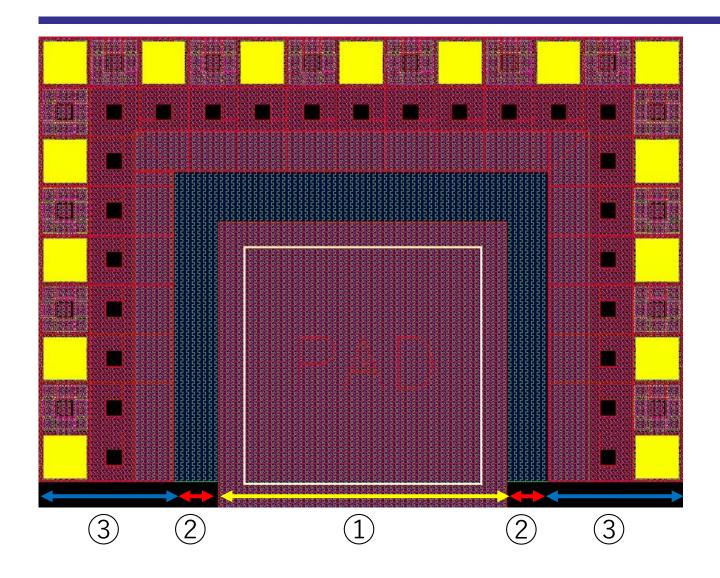




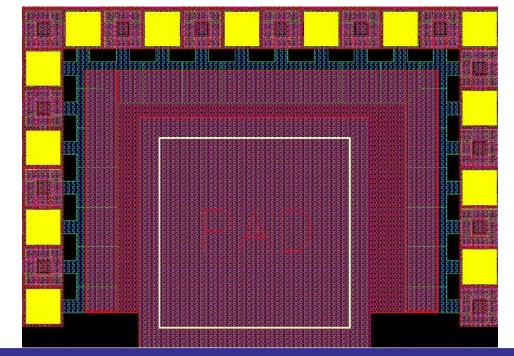
メッシュとPADの接続は上図のようにメタルを介して行うことでワイドメタルと メッシュをレイアウト上で接触しないようにすることでデザインルールを満たすこと ができる。VDDはメッシュと接続部分のレイヤーを入れ替える。

メッシュとPADの接続



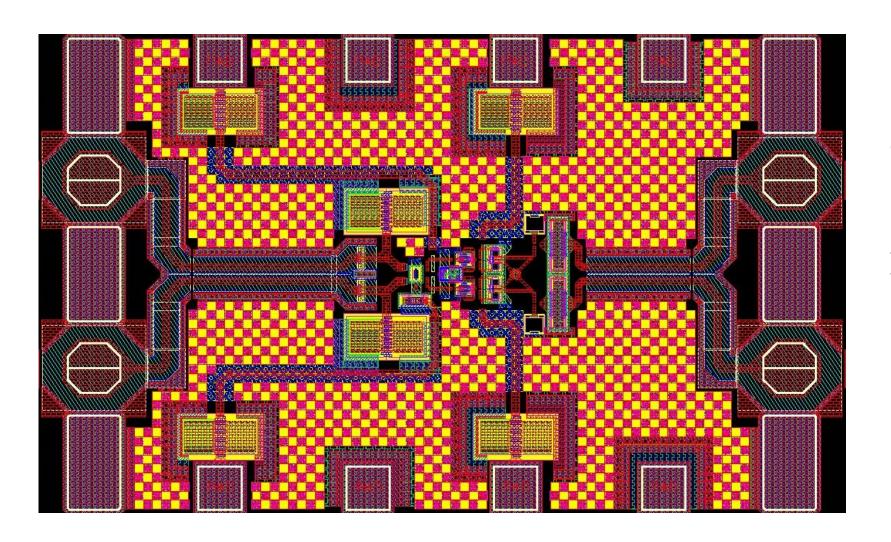


左図はGNDとメッシュとの 接続部分。 下の図はVDDとメッシュとの 接続部部分。



全体のレイアウト

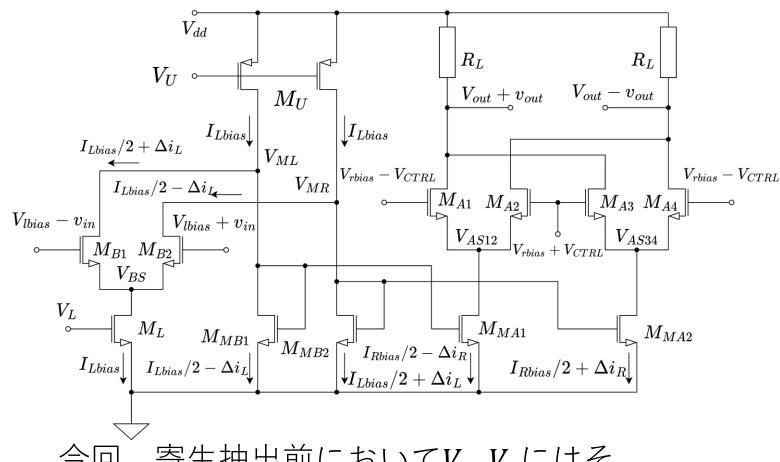




信号線の下にはあまり メッシュを引かないように 大学では、 は田研の DC PANEL(金色)とそのレイヤーを一部変更 し基板コンタクトを けたものを うに いたもの はためた。

DC解析



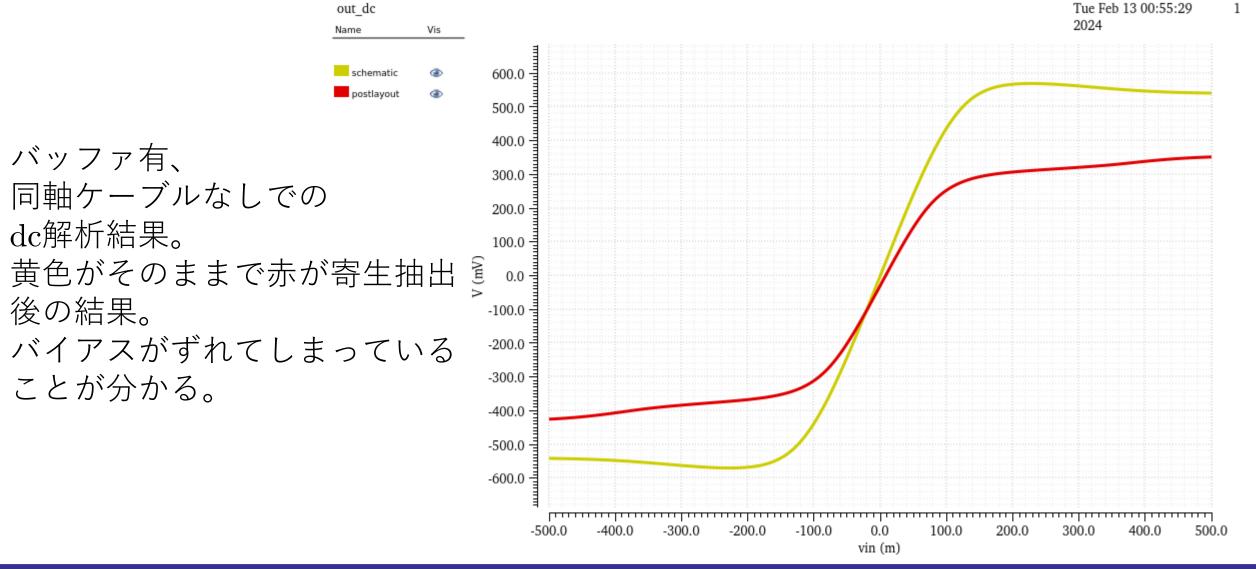


今回、寄生抽出前において V_U , V_L にはそれぞれ $830~\mu A$,1.156~m Aを流せるようなゲート電圧が入力されている。

	寄生抽出前	寄生抽出後
V_{lbias}	1.1	1.1
V_U	0.507	0.785
V_L	0.800	0.695
V_{M}	0.707	0.636
V_{BS}	0.295	0.383
V_{AS}	0.435	0.503
$V_{ m out}$	1.061	1.411
$I_{Lbias}(\pm)$	827μ	427μ
$I_{Lbias}(\overline{+})$	1.025m	538μ
I_{R_L}	1.1374 <i>m</i>	599μ

ポストレイアウトシミュレーション





まとめ



寄生抽出前後でシミュレーションとの誤差がかなり大きかった。

早急にこの原因究明とその解決を進める。